

Urkunde

über die Erteilung des
Patents Nr. 10 2014 220 698

Bezeichnung:

Hochfrequenz-Reflektometrie-Rastertunnelmikroskop

IPC:

G01Q 60/00

Inhaber/Inhaberin:

National Taiwan University, Taipei City, TW

Erfinder/Erfinderin:

Pai, Woei-Wu, Taipei City, TW; Li, Huan-Hsin, New Taipei City, TW; Chen, I-Jan, Taipei City, TW; Chao, Yen-Cheng, Taoyuan City, TW

Tag der Anmeldung:

13.10.2014

Tag der Veröffentlichung der Patenterteilung:

01.03.2018

Priorität:

17.07.2014 TW 103124553

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Cornelia Rudloff-Schäffer

Cornelia Rudloff-Schäffer



München, 01.03.2018